

DR-4

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ПЛЕНОК МОНОСУЛЬФИДА ОЛОВА

А. О. Браим, Н. В. Богомазова, И. М. Жарский

Белорусский государственный технологический университет, 220006, Беларусь, г. Минск, ул.

Свердлова, 13а

E-mail: braim.anastasiya@gmail.com

Экономичные пленки моносульфида олова перспективны для использования в качестве поглощающих слоев солнечных элементов, хемочувствительных слоев газовых сенсоров, проводящих каналов полевых транзисторов. Использование пленок SnS в электронных устройствах предполагает наличие достоверных данных об электрофизических свойствах этих слоев, включая их омическое состояние при обычной температуре и нагревании, значение энергии активации проводимости. Согласно литературным данным, удельное электросопротивление пленок варьируется от 10^2 до 10^6 Ом·см. В случае фотовольтаического применения необходимо обеспечить средний уровень электропроводности при высокой поглощающей способности пленок.

В данной работе изучались электрофизические свойства пленок SnS_x , полученных методом электрохимического осаждения в импульсном потенциостатическом режиме, при катодном потенциале около 1В, из электролита, содержащего SnCl_2 , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, CH_3COONa , при $\text{pH} \approx 2$. В качестве подложки использовалась стеклопластина с электропроводящим слоем смешанного оксида индия-олова (ITO) толщиной 50 – 100 нм. Температурные зависимости электросопротивления пленок исследовались в диапазоне 20–150 °C.

При одинаковых условиях электроосаждения нами были получены пленки SnS_x различной толщины, цвет которых изменялся от светло-серого до серо-черного, а оптическое пропускание подложек от – 60% (стекло / ITO) до 0,1% для наиболее толстой пленки SnS_x . Условием электроосаждения высокопоглощающей пленки SnS_x являлось достаточно низкое электросопротивление подслоя ITO (табл.1).

Таблица 1 – Электрофизические и оптические характеристики пленок SnS_x

Номер и хим. природа	Цвет	T, % $\lambda=380$ нм	Поверхностное электросопротивление, кОм		$\alpha_R^{20-150^\circ\text{C}}$, $\cdot 10^{-3}, \text{K}^{-1}$	E_a , эВ
			$R_{20, \text{SnS}_x}^{\text{cp}}$	R_{ITO}		
1ITO	бесцв.	56,7	–	0,029	+1,23	–
2ITO/ SnS_x	св.-серый	40,8	0,203	0,118	-3,15	0,035
3ITO/ SnS_x	св.-серый	35,4	0,222	0,120	-3,52	0,043
4ITO/ SnS_x	коричн.	11,6	0,235	0,117	-4,86	0,062
5ITO/ SnS_x	сер.-черн.	0,1	2001,01	0,034	-7,36	0,187

Анализ полученных электрофизических параметров пленок SnS_x показывает, что с увеличением их толщины и уменьшением прозрачности монотонно увеличивается поверхностное электросопротивление от 200 Ом до 2МОм. Низкоомное состояние пленок пониженной толщины, вероятно, обусловлено образованием переколяционных структур с участием подслоя ITO. Высокоомное состояние непрозрачной пленки повышенной толщины может быть обусловлено стехиометрическим избытком серы, характерным для электроосажденных слоев SnS. Все пленки SnS проявляли полупроводниковый характер проводимости с невысоким отрицательным температурным коэффициентом электросопротивления $5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Для высокопоглощающей пленки SnS_x (образец 5) энергия активации проводимости составила 0,187 эВ, что указывает на генерацию носителей заряда с участием глубоких электроактивных центров. Таким образом, при достаточно высокой электропроводности подслоя ITO возможно электроосаждение термостабильных высокопоглощающих пленок SnS_x с повышенным электросопротивлением.